Сотрудники «Центра технологий National Instruments» СФУ подготовили к изданию учебное пособие нового поколения

В издательстве ДМК-Пресс при поддержке Российского представительства корпорации **National Instruments** готовится к выпуску книга «Исследование параметров и характеристик полупроводниковых приборов с применением Internet-технологий». Авторы: А. С. Глинченко, Н. М. Егоров, В. А. Комаров, А. В. Сарафанов.

В издании рассмотрены задачи, методы и особенности автоматизированного лабораторного практикума с удаленным доступом (АЛП УД) по исследованию полупроводниковых приборов. Дано описание реализующей его системы АЛП УД «Электроника», в том числе входящего в ее состав аппаратно-программного комплекса (АПК) «Электроника», разработанного на основе технологии корпорации National Instruments в региональном инновационном центре «Центр технологии National Instruments» при ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет». Приведены задания и методические указания к лабораторным работам по экспериментальному исследованию и моделированию полупроводниковых диодов, стабилитронов, полевых и биполярных транзисторов, включающие измерение их вольт-амперных характеристик и параметров, исследование технологического разброса и работы на переменном токе.

Пособие предназначено для студентов и учащихся технических специальностей вузов, колледжей, профессиональных училищ и лицеев для использования в лабораторном практикуме дисциплины «Электроника» и других родственных дисциплин, выполняемом на базе сетевой лаборатории Сибирского федерального округа с помощью АПК УД «Электроника».

Планируемый срок выпуска: декабрь 2007 г.

А. Г. Суковатый, директор Центра технологий электронного обучения СФУ, 23 ноября 2007 г.

© Сибирский федеральный университет. Редакция сайта: +7 (391) 246-98-60, info@sfu-kras.ru.

Адрес страницы: https://news.sfu-kras.ru/node/2494